



测量仪器附带检查成绩单

Formtracer CS-3200S4 525 系列 — 表面粗糙度和轮廓测量系统

- 配有宽范围且高分辨力的Z轴检出器。
- 测量范围
Z1轴 (检出器): 5mm
(分辨力: 0.0008μm
测量范围为0.05mm时适用)
X轴: 100mm
(分辨力: 0.05μm)
- 检出器的延伸量: 最大70mm(可固定在所需的位置)。



- 使用官方FORMTRACEPAK软件提供了丰富多样的分析功能以实现优良的表面纹理评估。



CS-3200S4

规格

型号		CS-3200S4	
测量范围/分辨力	X轴	100mm/0.05μm	
	Z1轴 (检出器)	5mm/0.08μm	
		0.05mm/0.0008μm	
Z2轴 (立柱)	300mm/1μm		
精度 (20°C)	X轴	±(0.8+0.01L)μm (L= 测量长度(mm))	
	Z1轴 (检出器)	±(1.5+2H/100)μm H= 水平位置上的测量高度 (mm)	
驱动部	直线度 (X轴)	正常使用下	0.2μm/100mm
		当伸出到最大程度	0.4μm/100mm
	测量速度	表面粗糙度测量	0.02, 0.05, 0.1, 0.2mm/s (4级)
		轮廓测量	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0mm/s (7级)
	驱动速度	X轴 (水平方向)	0-80mm/s外加手动
	Z2轴 (垂直方向)	0-20mm/s外加手动	
	上下移动	300mm (电动)	
	倾角范围	±45°	
检出器	检出方式	差动感应	
	测力	0.75mN	
	测针名称	标准测针 (用于粗糙度/轮廓测量) 针尖角度: 60° 圆锥, 针尖半径: 2μm, 金刚石针尖 圆锥型 (用于轮廓测量) 针尖角度: 30° 圆锥, 针尖半径: 25μm, 蓝宝石针尖	
	测针上下运作	适用 (可在半空停顿)	

* 仪器本体的一部分采用天然石材, 所以表面会有些纹理的情况。

* 可根据需求订制Z2轴立柱规格, X轴200mm型等, 详细请咨询我们。